**AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSEN MUUTOSHAKEMUS**

Akkreditoidun toimielimen nimi:

Akkreditointitunnus:

Voimassa oleva päätös:

Haemme nykyiseen akkreditointipäätökseemme:

pätevyysalueen laajennusta, esitys liite 1

pätevyysalueen päivitystä, esitys liite 1

pätevyysalueen supistusta, esitys liite 1

muu muutos (organisaatio, toimipisteet…). Mikä?

Oheistamme muutosta/laajennusta koskevat oleelliset lisätiedot alla olevan **liiteluettelon** mukaisesti:

1. Pätevyysalueen muutosesitys Liite 1
2. Menetelmäohjeet, validointitiedot ja vertailumittaustulokset
3. Toimintaohjeet.
4. Laadunvarmistusmenettelyihin liittyvät ohjeet ja suunnitelmat sekä ulkoisten vertailumittausten tulosten yhteenveto.
5. Kyseisen toiminnan vastuuhenkilöt, uusien henkilöiden osalta CV:t.
6. Mittausepävarmuuslaskelmat suurekohtaisesti.
7. Laiterekisteri ja tiedot referenssi- ja käyttönormaalien kalibroinneista.
8. Tiedot seurattavasta kenttäkalibroinnista sekä siihen liittyvät menetelmäohjeet.
9. Muu muutoshakemuksen arviointia tukeva aineisto.

Aineisto pyydetään toimittamaan sähköisesti. Voitte toimittaa aineiston itse valitsemallanne tavalla, esim.:

* Dokumenttien välitysohjelman kautta (ilmainen / maksullinen)
* Antamalla pääsyn järjestelmäänne
* Käytössänne olevan turvasähköpostijärjestelmän kautta
* Sähköpostitse (tietoturvallisuusnäkökulmasta tämä ei ole suositeltava tapa)

Kalibrointilaboratorion edustaja:

pp.kk.vvvv, Etunimi Sukunimi

Akkr.tunnus: K

| PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUKSET, esimerkiksi uudet suureet/menetelmät/kohteet, mittausalueet ja/tai mittauskyvyt (lisätkää rivejä tarvittaessa)  Huom. Myös kieliversiot. | | |
| --- | --- | --- |
| **Suure / menetelmä / kohde** *Quantity / method / object* | **Mittausalue** *Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)** *CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.  Kaarimikrometri *External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µm |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| MUUTOKSET/PÄIVITYKSET PÄTEVYYSALUEEN MENETELMIIN, esimerkiksi mittausalueen ja/tai mittauskyvyn muutokset (lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. | | |
| --- | --- | --- |
| **Suure / menetelmä / kohde** *Quantity / method / object* | **Mittausalue** *Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)** *CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.  Kaarimikrometri *External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µm  PÄIVITETÄÄN |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| PÄTEVYYSALUEEN SUPISTUKSET (lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. | | |
| --- | --- | --- |
| **Suure / menetelmä / kohde** *Quantity / method / object* | **Mittausalue** *Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)** *CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.  Kaarimikrometri *External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µm  PÄIVITETÄÄN |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |